

令和 4 年 7 月 15 日付入札公告「DX 人材育成の実践的 DX 電気電子計測・制御システム一式」にかかる仕様書の一部について、以下のとおり訂正します。

訂正箇所及び内容

Ⅱ. 調達物品に備えるべき技術的要件

B. 性能, 機能に関する要件

c) デスクトップ X 線回折装置 一式

4. 検出器部 の 「1) 方式」 及び 「4) 検出方法」 部分について

①

(変更前) 1) 方式 : 直接検出型 1 次元以上の半導体検出器であること。

を

(変更後) 1) 方式 : 直接検出型 1 次元以上の半導体検出器であること。2 次元検出器の場合は、検出器の載せ替え無しに 1 次元、2 次元の測定モードの切り替えが可能であること。

とします。

②

(変更前) 4) 検出方法 : 検出器の載せ替え無しに 1 次元、2 次元の測定モードの切り替えが可能であること。

を

(変更後) 削除します。

上記の訂正により、c) デスクトップ X 線回折装置一式 の 4. 検出器部は、

1) 方式 : 直接検出型 1 次元以上の半導体検出器であること。2 次元検出器の場合は、検出器の載せ替え無しに 1 次元、2 次元の測定モードの切り替えが可能であること。

2) 素子幅 : 検出素子の幅は 100 μm 以下であること。

3) 検出効率 : 検出効率は Cu-K α 波長において 99%以上であること。

とします。

以上